(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-335279

(43)公開日 平成10年(1998)12月18日

(51) Int.Cl.6

識別記号

H01L 21/304

341

FΙ

H 0 1 L 21/304

341B

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 7 頁)

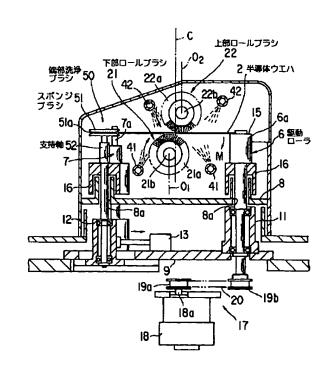
(21)出願番号	特顧平9-142102	(71)出顧人 000002428	
		株式会社芝浦製作所	
(22)出顧日	平成9年(1997)5月30日	神奈川県横浜市栄区笠間町1000番	地1
		(72)発明者 黒川 禎明	
		神奈川県横浜市栄区笠間町1000番	地1 株
		式会社芝浦製作所大船工場内	
		(72)発明者 松嶋 大輔	
		神奈川県横浜市栄区笠間町1000番	地1 株
		式会社芝浦製作所大船工場内	, m - , , ,
		(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦 (外6名)	
		CONTRACTOR SINCE SALE SALES OF CHILD	
		l .	

(54) 【発明の名称】 洗浄装置

(57)【要約】

【課題】 この発明はワークの上下面をロールブラシに よって均一にブラシ洗浄できるとともに、ワークの端部 の洗浄も可能な洗浄装置を提供すること。

【解決手段】 円盤状のワーク2の上下面を同時にブラシ洗浄する洗浄装置において、軸線を上下方向に沿わせて回転自在に配設されるとともにワーク2の周辺部が係合する係合部15が形成された駆動ローラ6と、この駆動ローラ6を回転駆動する第1の駆動手段17と、駆動ローラ6の係合部15に周辺部を係合させたワーク2の下面に接する下部ロールブラシ21および上面に接する上部ロールブラシ22とをワーク2が駆動ローラ6に押し付けられる方向に回転駆動する第2の駆動手段20Aと、軸線を上下方向に沿わせて回転自在に配設されるとともにワーク2の周辺部に接触する端部洗浄ブラシと、を具備したことを特徴とする。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 円盤状のワークの上下面を同時にブラシ 洗浄する洗浄装置において、

軸線を上下方向に沿わせて回転自在に配設されるととも に上記ワークの周辺部が係合する係合部が形成された駆動ローラと、

この駆動ローラを回転駆動する第1の駆動手段と、

上記駆動ローラの係合部に周辺部を係合させた上記ワークの下面に接する下部ロールブラシおよび上面に接する 上部ロールブラシと、

上記下部ロールブラシと上部ロールブラシとを上記ワークが上記駆動ローラに押し付けられる方向に回転駆動する第2の駆動手段と、

軸線を上下方向に沿わせて回転自在に配設されるととも に上記ワークの周辺部に接触する端部洗浄ブラシと、 を具備したことを特徴とする洗浄装置。

【請求項2】 円盤状のワークの上下面を同時にブラシ 洗浄する洗浄装置において、

上記ワークの周辺部が係合する係合部が形成され軸線を 上下方向に沿わせて回転自在に設けられるとともに上記 20 ワークの所定の径方向の一端側に配設された複数の駆動 ローラと、

この駆動ローラを回転駆動する第1の駆動手段と、

上記駆動ローラの係合部に周辺部を係合させた上記ワークの下面に接する下部ロールブラシおよび上面に接する 上部ロールブラシと、

上記下部ロールブラシと上部ロールブラシとを上記ワークが上記駆動ローラに押し付けられる方向に回転駆動する第2の駆動手段と、

軸線を上下方向に沿わせて回転自在かつ上記ワークの上 30 記所定の径方向の他端側に配設され上記ワークが径方向 にずれ動いて上記駆動軸の係合部から外れるのを阻止す る規制ローラと、

軸線を上下方向に沿わせて回転自在に配設されるととも に上記ワークの周辺部に接触する端部洗浄ブラシと、 を具備したことを特徴とする洗浄装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は円盤状のワークの 上下面をロールブラシによって同時に洗浄するための洗 40 浄装置に関する。

[0002]

【従来の技術】たとえば半導体装置の製造工程においては、ワークとしての半導体ウエハを高い清浄度で洗浄することが要求される工程がある。このようなワークを洗浄する方式としては、洗浄液中に複数枚のワークを浸漬するデイップ方式や被洗浄基板に向けて洗浄液を噴射して一枚づつ洗浄する枚葉方式があり、最近では高い清浄度が得られるとともに、コスト的に有利な枚葉方式が採用されることが多くなってきている。

2

【0003】枚葉方式の1つとしてロールブラシを用いた洗浄装置が知られている。この洗浄装置はワークを搬送ラインによって所定方向に直線的に搬送するとともに、その搬送途中に、上記ワークの表裏両面にブラシ毛が接触する状態で複数のロールブラシを、その軸線をワークの搬送方向に対して直交させて配置し、洗浄液を供給しながら各ロールブラシを回転させることで、上記ロールブラシによって上記ワークの表裏両面に付着した微粒子を除去するようにしている。

10 【0004】また、ワークが円板状に設けられた半導体 ウエハ等の場合には、このワークの均一な洗浄度の向上 を図るために、このワークを保持する部分に駆動力を伝 達してワークを回転させ、また駆動力を伝達せずに回転 をガイドする機構が設けられているとともに、上記ワー クの上下両面より下部ロールブラシと上部ロールブラシ を接触させ、これらのロールブラシを回転させるための 駆動機構を設けた洗浄装置が存在する。

【0005】このような洗浄装置によると、ワークは回転しながら上下一対のロールブラシによってブラシ洗浄されるため、このワークの上下面が全体に亘って均一に洗浄されるようになっている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】このように、従来の搬送タイプの洗浄装置は、搬送ラインによって直線搬送されるワークの上下面に、軸線をワークの搬送方向に対して直交させて配置されたロールブラシを接触させるようにしているため、ロールブラシのブラシ毛の摩耗状態が不均一であったり、配置状態が傾いていたりすると、上記ワークの上下面を全体にわたって均一な清浄度で洗浄できないということがあった。

【0007】また、従来の回転タイプの洗浄装置は、上記ワークの端部においてパーティクルが除去されず残ってしまうことがある。すなわち、ワークの上下両面にはロールブラシが接触するために、このワークの上下両面のパーティクルの除去が良好に行われるものとなっているが、ワークの端部においては、ロールブラシが直接接触しないため、この端部にパーティクルが付着して除去され難いものとなっている。

【0008】このワークの端部にパーティクルが付着し たまま、ワークを収納するバッジの内部へ収納すると、 端部に付着したパーティクルが飛散して、洗浄が終了し た他のワークの上下両面に付着して、このワークの上下 両面を再び汚染することがある。

【0009】この発明は上記事情に基づきなされたもので、その目的とすることろは、ワークの上下面全体をロールブラシによって均一に洗浄することができるとともに、ワークの端部の洗浄をも行うことが可能な洗浄装置を提供することにある。

[0010]

50 【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため

に請求項1の発明は、円盤状のワークの上下面を同時にブラシ洗浄する洗浄装置において、軸線を上下方向に沿わせて回転自在に配設されるとともに上記ワークの周辺部が係合する係合部が形成された駆動ローラと、この駆動ローラを回転駆動する第1の駆動手段と、上記駆動ローラの係合部に周辺部を係合させた上記ワークの下面に接する下部ロールブラシおよび上面に接する上部ロールブラシと、上記下部ロールブラシと上部ロールブラシとを上記ワークが上記駆動ローラに押し付けられる方向に回転駆動する第2の駆動手段と、軸線を上下方向に沿わ10せて回転自在に配設されるとともに上記ワークの周辺部に接触する端部洗浄ブラシと、を具備したことを特徴とする。

【0011】請求項2の発明は、円盤状のワークの上下 面を同時にブラシ洗浄する洗浄装置において、上記ワー クの周辺部が係合する係合部が形成され軸線を上下方向 に沿わせて回転自在に設けられるとともに上記ワークの 所定の径方向の一端側に配設された複数の駆動ローラ と、この駆動ローラを回転駆動する第1の駆動手段と、 クの下面に接する下部ロールブラシおよび上面に接する 上部ロールブラシと、上記下部ロールブラシと上部ロー ルブラシとを上記ワークが上記駆動ローラに押し付けら れる方向に回転駆動する第2の駆動手段と、軸線を上下 方向に沿わせて回転自在かつ上記ワークの上記所定の径 方向の他端側に配設され上記ワークが径方向にずれ動い て上記駆動軸の係合部から外れるのを阻止する規制ロー ラと、軸線を上下方向に沿わせて回転自在に配設される とともに上記ワークの周辺部に接触する端部洗浄ブラシ と、を具備したことを特徴とする。

【0012】請求項1の発明によれば、ワークが下部ロールブラシと上部ロールブラシの回転駆動によって駆動ローラに押し付けられ、この駆動ローラが第1の回転駆動手段によって回転駆動されるから、その回転がワークに伝達され、上記ワークが回転しながら上下一対のロールブラシによってブラシ洗浄される。

【0013】これとともに、上記ワークの周辺部に接触する端部洗浄ブラシが設けられたため、上記ワークは上下両面だけでなく、ワークの端部においても良好に洗浄を行うことが可能となっている。

【0014】請求項2の発明によれば、ワークは駆動ローラによって回転させられながら上下一対のロールブラシで洗浄されるとともに、規制ローラによって径方向にずれ動くのが規制されるため、ロールブラシにより洗浄されているときに駆動ローラの係合部から外れるのが確実に防止され、このワークが回転時にずれずに位置決めされるようになる。

【0015】そのため、上記端部洗浄ブラシによって、 なっている。それによって、」 ワークの端部に端部洗浄ブラシを確実に接触させること する洗浄液が上記通孔8aからが可能となり、ワーク端部の良好な洗浄を行うことが可 50 へ流出するのを阻止している。

能となっている。

[0016]

【発明の実施形態】以下、この発明の一実施形態を図面を参照して説明する。図2に示すようにこの発明の洗浄装置は洗浄槽1を備えている。この洗浄槽1には導入口3が形成されている。この導入口3からは、ワークとしての未洗浄の半導体ウエハ2が図示しない受け渡しロボットによって内部に導入されるようになっている。上記洗浄槽1の上記一側壁に隣接する側壁には洗浄された半導体ウエハ2を同じく図示しない受け渡しロボットによって搬出するための導出口4が形成されている。上記導入口3と導出口4はシャッタ3a、4aによって開閉自在とされるようになっている。

【0017】上記洗浄槽1内にはユニットケース5が設面を同時にブラシ洗浄する洗浄装置において、上記ワークの周辺部が係合する係合部が形成され軸線を上下方向に沿わせて回転自在に設けられるとともに上記ワークの所定の径方向の一端側に配設された複数の駆動ローラと、この駆動ローラを回転駆動する第1の駆動手段と、上記駆動ローラの係合部に周辺部を係合させた上記ワークの下面に接する下部ロールブラシおよび上面に接する

【0018】上記各ローラ6、7の配置状態をさらに詳述する。すなわち、図1に示すように上記ユニットケース5の内底部は仕切板8によって隔別され、この仕切板8の下方には支持板9が配設されている。上記駆動ローラ6と規制ローラ7とは上記仕切板8に形成された通孔8aを貫通している。駆動ローラ6の下端部は上記支持板9に立設された第1の軸受体11によって回転自在かつスラスト方向にスライド不能に支持されている。

30 【0019】上記規制ローラ7の下端部は第2の軸受体 12によって回転自在かつスラスト方向にスライド不能 に支持されている。上記第2の軸受体12は上記支持板 9にスライド自在に設けられていて、図1に矢印で示す ように駆動シリンダ13により上記駆動ローラ6に対し て接離する方向に駆動されるようになっている。

【0020】上記駆動ローラ6の上部には大径部6aが設けられ、その大径部6aの上面は上記半導体ウエハ2の周辺部が係合する係合部15となっている。係合部15は水平面となっているが、径方向外方に行くにつれて低く傾斜する傾斜面であってもよい。

【0021】上記規制ローラ7の上部は小径部7aに形成され、この小径部7aは上記半導体ウエハ2の周辺部に接触して上記係合部15に係合保持された半導体ウエハ2が径方向にずれ動くのを規制するようになっている。

【0022】上記駆動ローラ6と規制ローラ7とが仕切板8の通孔8aを貫通した箇所はラビリンス構造16となっている。それによって、上記半導体ウエハ2を洗浄する洗浄液が上記通孔8aからユニットケース5の外部へ流出するのを阻止している。

【0023】上記駆動ローラ6は第1の駆動機構17によって回転駆動されるようになっている。この第1の駆動機構17は図1に示すように上記支持板9の下方に配置されたモータ18を有する。このモータ18の回転軸18aには駆動プーリ19aが嵌着されている。この駆動プーリ19aと上記各駆動ローラ6の下端部にそれぞれ嵌着された3つの従動プーリ19bとの間にはベルト20が図示しないテンショローラによって張力を調整されて張設されている。したがって、上記モータ18が作動すれば、ベルト20を介して上記各駆動ローラ6を回10転駆動することができるようになっている。

【0024】上記ユニットケース5内には下部ロールブラシ21と上部ロールブラシ22とが軸線O1、O2を上記ユニットケース5の中心線Cに対して平行、かつその中心線Cと直交する方向に対してずらして配置されている。つまり、下部ロールブラシ21の軸線O1は上記中心線Cよりも規制ローラ7側に位置しており、上部ロールブラシ22の軸線O2は駆動ローラ6側に偏倚されている。

【0025】上記下部ロールブラシ21と上部ロールブ 20 ラシ22とは第2の駆動機構20Aによってそれぞれ回 転駆動されるとともに、上下駆動機構20Bによって上 下方向に駆動されるようになっている。

【0026】つまり、各ロールブラシ21、22のブラシ毛21a、22aが設けられたロール軸21b、22bの一端部は図2に示すようにユニットケース5の一側壁から突出し、その突出部分には軸受体23とモータ24とが一体化された駆動ユニット25が設けられている。

【0027】各駆動ユニット25の軸受体23には上記 30 ロール軸21b、22bが回転自在に支持されているとともに、その軸受体23の内部で上記モータ24の回転軸(図示せず)に連結されている。上記下部ロールブラシ21と上部ロールブラシ22とはそれぞれモータ24によって図1に矢印で示すように互いに逆方向であるとともに、これらロールブラシ21、22間に供給された半導体ウエハ2をその回転力で駆動ローラ6の外周面に押し付ける方向に回転駆動されるようになっている。

【0028】上記一対の駆動ユニット25には、図2と図3に示すようにそれぞれアーム26の一端が固着され 40 ている。各アーム26の他端部は、上記ユニットケース5の近傍に配置されたハウジング27の一側壁に形成された縦長の通孔28からその内部に導入されている。各アーム26の他端には取付板29が取着され、各取付板29にはスライダ31が設けられている。各スライダ31は上記ハウジング27の他側内面に垂直方向に沿って設けられたリニアガイド32にスライド自在に係合保持されている。

【0029】一対のアーム26の他端部にはナット体3 3が設けられている。各ナット体33にはそれぞれボー ルねじ34が螺合している。各ボールねじ34は上下端 部がそれぞれ上記ハウジング27の上下内面に設けられ た軸受35に回転自在に支持されている。

【0030】上記ボールねじ34の下端部はハウジング27の下端から突出し、その突出端には従動プーリ36が嵌着されている。各従動プーリ36の近傍にはモータ37が配設され、このモータ37の回転軸37aに嵌着された駆動プーリ38と上記従動プーリ36との間にはベルト39が張設されている。

【0031】したがって、上記モータ37が作動すれ ば、ボールねじ34が回転駆動される。それによって、 ボールねじ34に螺合されたナット体33を介してアー ム26がリニアガイド32に沿って上下方向に駆動され ることになる。つまり、下部ロールブラシ21と上部ロ -ルブラシ22とを上下方向に駆動させることができる から、各ロールブラシ21、22を半導体ウエハ2の下 面と上面とに所定の接触力で接触させることができる。 【0032】上記規制ローラ7は、図2においては所定 間隔で2つ設けられているが、これら2つの規制ローラ 7の間の位置には、上記半導体ウエハ2の端部を洗浄す るための端部洗浄ブラシ50が設けられている。この端 部洗浄ブラシ50は、例えばPVA (ポリビニルアルコ ール)やポリウレタン系材料を材質とするスポンジブラ シ51を有しており、このスポンジブラシ51が上記半 導体ウエハ2の端部に接触して回転可能に設けられてい

【0033】そのために、上記スポンジブラシ51は、上下両面より中間部分へ向かうにしたがって、所定角度で傾斜する凹部51aが形成されたプーリ状を成している。そのため、この凹部51aに半導体ウエハ2の端部が入り込んで、このスポンジブラシ51が弾性変形しながら上記半導体ウエハ2の上下両面の周縁部、およびこの半導体ウエハ2の端部に接触し、この端部および周縁部に付着したパーティクルの除去を行うことが可能な構成となっている。

【0034】上記スポンジブラシ51を支持するため、このスポンジブラシ51の下面側には支持軸52が一体的に取り付けられている。この支持軸52の、上記仕切板8の通孔8aを貫通した箇所はラビリンス構造16となっており、上記半導体ウエハ2に近接する部分に、スポンジブラシ51を軸支して摺動する部材が設けられない構成となっている。このため、上記半導体ウエハ2を洗浄する洗浄液が通孔8aからユニットケース5の外部へ流出するのを防ぐことを防止し、またラビリンス構造16によって支持軸の摺動部分より発生するパーティクルが上記半導体ウエハ2に付着するのを防止する構成となっている。

【0035】また、上記支持軸52の下端部は、上述の 規制ローラ7と同様に、第2の軸受体12によって回転 自在かつスラスト方向にスライド自在に設けられてい

50

て、上記スポンジブラシ51が従動的に回転するように 設けられている。また図1の矢印に示すように、駆動シ リンダ13によって上記駆動ローラ6に対して接離する 方向に駆動されるようになっている。

【0036】なお、このようにスポンジブラシ51は従動的に回転する構成となっているが、スポンジブラシ51に駆動力を付加して強制的に半導体ウエハ2の端部を洗浄する構成としても構わない。

【0037】また、上記半導体ウエハ2の端部および周緑部を良好に洗浄する構成であれば、このスポンジブラ 10シ51の設けられる位置および個数は、上述の構成に限定されない。

【0038】上述したごとく、上記半導体ウエハ2は上部ロールブラシ22から受ける押圧力によって駆動ローラ6側に位置する周辺部が係合部15に押し付けられ、また下部ロールブラシ21も半導体ウエハ2に当接することによって、この半導体ウエハ2の上下両面を上記ロールブラシ21、22の回転力と、上部ロールブラシ22の押圧力とによって上記駆動ローラ6に押し付けられることになるため、上記駆動ローラ6の回転力が半導体20ウエハ2に伝達されることになる。

【0039】また上記下部ロールブラシ21と上部ロールブラシ22との近傍には、それぞれ一対のパイプ状の下部ノズル41と上部ノズル42とが配置されており、これらより上記半導体ウエハ2の上下面を一対のブラシ21、22によって洗浄するときに洗浄液が供給されるようになっている。

【0040】つぎに、上記構成の洗浄装置によって半導体ウエハ2を洗浄するときの動作について説明する。まず、一対の規制ローラ7およびスポンジブラシ51を駆動シリンダ13によって図4に鎖線で示すように駆動ローラ6から離反する方向へ後退させるとともに、下部ロールブラシ21を下降させ、上部ロールブラシ22を上昇させてこれらロールブラシ21、22を図3に鎖線で示すように所定の間隔で離反させる。

【0041】その状態で一対のロールブラシ21、22間に未洗浄の半導体ウエハ2を、その周辺部の径方向一端側が3本の駆動ローラ6の係合部15に係合するよう図示しない受け渡しロボットで供給する。供給後、下部ロールブラシ21を上昇させて半導体ウエハ2の下面に40接触させ、半導体ウエハ2を上記係合部15とでほぼ水平に支持し、ついで上部ロールブラシ22を下降させて半導体ウエハ2の上面に所定の圧力で接触させる。

【0042】一対のロールブラシ21、22を所定の高さに位置決めしたならば、駆動シリンダ13を作動させて一対の規制ローラ7をその小径部7aが上記半導体ウエハ2の径方向他端側、つまり係合部15に係合した部分と径方向の反対側の部分の外周面に当接するまであるいはわずかな間隔を介して近接するまで前進方向へ駆動する。

【0043】このようにして半導体ウエハ2を保持したならば、受け渡しロボットを後退させ、下部ロールブラシ21とト部ロールブラシ22および3本の駆動ローラ

シ21と上部ロールブラシ22および3本の駆動ローラ6を回転駆動する。

【0044】一対のロールブラシ21、22が回転駆動されることで、半導体ウエハ2の上下面がブラシ洗浄されるとともに、これらロールブラシ21、22の回転力によって外周面の径方向一端側が駆動ローラ6に押し付けられる。

) 【0045】これとともに、上記半導体ウエハ2の周縁 部および端部も上記スポンジブラシ51の凹部51aに 接触し、この半導体ウエハ2の周縁部および端部が接触 することによって上記凹部51aが弾性変形するように なっている。

【0046】また、上部ロールブラシ22が下部ロールブラシ21よりも駆動ローラ6側に偏倚していることで、半導体ウエハ2には図1に矢印Mで示す方向の回転モーメントが生じる。そのため、半導体ウエハ2は上記モーメントMによって、周辺部の上記駆動ローラ6側の部分が係合部15に押し付けられる。

【0047】このように、半導体ウエハ2が駆動ローラ 6に押し付けられることで、半導体ウエハ2には上記駆動ローラ6の回転力が伝えられ、それによって、半導体ウエハ2は一対のロールブラシ21、22との接触力に抗して上記駆動ローラ6により回転させられる。これとともに、半導体ウエハ2は、上記ロールブラシ21、22を回転させるだけでなく、半導体ウエハ2の上下面に対して万遍なく摺接する。すなわち、上記ロールブラシ21、22を回転させるだけでなく、半導体ウエハ2も回転させると、半導体ウエハ2の所定の部分にロールブラシ21、22の所定の部分だけが接触するということがなくなるから、ブラシ毛21a、22aの摩耗状態が不均一であったり、軸線が傾いているなどしても、半導体ウエハ2の上下両面の全面に亘ってほぼ均一に洗浄することが可能となる。

【0048】また、上記半導体ウエハ2の上下両面の全面に亘ってほぼ均一に洗浄できるとともに、半導体ウエハ2の端部および周縁部もスポンジブラシ51によって良好に洗浄し、この部分にパーティクルが付着するのを防止することが可能となっている。

【0049】そのため、上記半導体ウエハ2をバッジ内部に他の半導体ウエハ2とともに収納する場合でも、この半導体ウエハ2の端部のパーティクルが除去されるので、他の半導体ウエハ2の上下両面に端部よりパーティクルが飛散して付着することがなくなる。

【0050】また、規制ローラ7によって半導体ウエハ 2が径方向にずれ動くのが制限され、係合部15から外 れるようなことがなくなり、駆動ローラ6の回転を上記 半導体ウエハ2に確実に伝達することができる。これと 50 ともに、上記半導体ウエハ2がずれ動くのが制限されて

位置決めされるため、上記半導体ウエハ2にスポンジブ ラシ51を確実に接触させることが可能となっている。 【0051】なお、上記一実施形態では駆動ローラを3 本としたが、その数は限定されるものでなく、2本以下 あるいは4本以上であってもよい。駆動ローラが1本で あっても、半導体ウエハ2を回転させたり、下部ロール ブラシ21とで保持することは可能であるが、2本以上 の方が安定性が向上する。

【0052】また、半導体ウエハ2が径方向にずれるの を規制するために2本の規制ローラ7を設けたが、半導 10 能となっている。 体ウエハ2は一対のロールブラシ21、22の回転力 と、上部ロールブラシ22の押圧力とによって駆動ロー ラ6に押し付けられているから上記規制ローラ7がなく とも、半導体ウエハ2を所定の状態で保持しながら洗浄 することは可能である。

【0053】さらに、ワークとしては半導体ウエハ2以 外のものであってもよく、要は円盤状で上下面を洗浄す る必要があるものであればよい。また、上記スポンジブ ラシ51はプーリ状に形成されたものとなっているが、 他の形状を有している構成であっても構わない。

[0054]

【発明の効果】以上述べたように請求項1の発明によれ ば、ワークが下部ロールブラシと上部ロールブラシの回 転駆動によって駆動ローラに押し付けられ、この駆動ロ ーラが第1の回転駆動手段によって回転駆動されるか ら、その回転がワークに伝達され、上記ワークが回転し ながら上下一対のロールブラシによってブラシ洗浄され

【0055】これとともに、上記ワークの周辺部に接触 する端部洗浄ブラシが設けられたため、上記ワークは上 30 25…駆動ユニット 下両面だけでなく、ワークの端部においても良好に洗浄 を行うことが可能となっている。

【0056】請求項2の発明によれば、ワークは駆動ロ

ーラによって回転させられながら上下一対のロールブラ シで洗浄されるとともに、規制ローラによって径方向に ずれ動くのが規制されるため、ロールブラシにより洗浄 されているときに駆動ローラの係合部から外れるのが確 実に防止され、このワークが回転時にずれずに位置決め されるようになる。

1.0

【0057】そのため、上記端部洗浄ブラシによって、 ワークの端部に端部洗浄ブラシを確実に接触させること が可能となり、ワーク端部の良好な洗浄を行うことが可

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施形態の全体構成を示すユニッ トケースの縦断面図。

【図2】同じく洗浄槽の横断面図。

【図3】同じく一対のロールブラシを上下駆動する機構 の側面図。

【図4】同じく駆動ローラ、従動ローラおよび一対のロ ールブラシの配置状態の斜視図。

【符号の説明】

20 2…半導体ウエハ(ワーク)

6…駆動ローラ

7…規制ローラ

15…係合部

17…第1の駆動機構(駆動手段)

18…第1の駆動機構のモータ

20A…第2の駆動機構

21…下部ロールブラシ

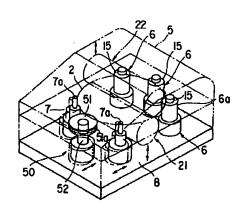
22…上部ロールブラシ

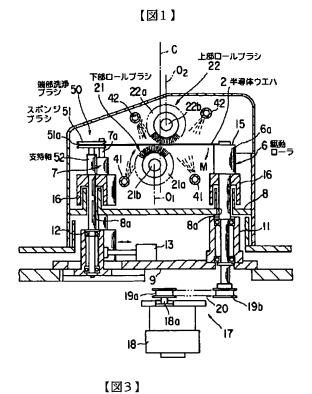
24…第2の駆動機構のモータ

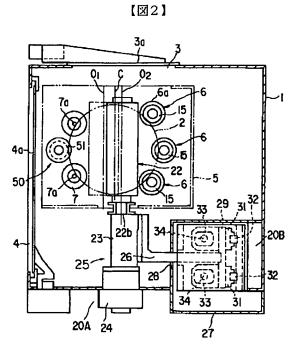
50…端部洗浄ブラシ

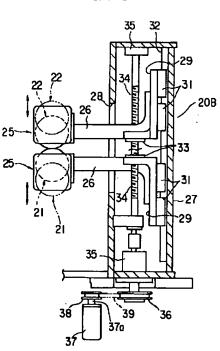
51…スポンジブラシ

【図4】









DERWENT-ACC-NO: 1999-111977

DERWENT-WEEK:

199910

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Washing apparatus for e.g. disc-shaped

semiconductor

wafer during semiconductor wafer manufacturing

- has

wafer edge cleaning brush which is provided

horizontally

with semiconductor wafer, to contact with

peripheral edge

of wafer

PATENT-ASSIGNEE: SHIBAURA SEISAKUSHO KK[SHBE]

PRIORITY-DATA: 1997JP-0142102 (May 30, 1997)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 10335279 A December 18, 1998 N/A

007 H01L 021/304

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

N/AJP 10335279A 1997JP-0142102

May 30, 1997

INT-CL (IPC): H01L021/304

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 10335279A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - A wafer edge cleaning brush (50) is provided horizontally with a

semiconductor wafer (2), to contact with the peripheral edge. DETAILED

DESCRIPTION - A drive roller (6) driven by a first drive mechanism (17), has a

connection unit (15) connected to the peripheral edge of the semiconductor

wafer (2). An upper roll brush (22) and a lower roll brush (21) contacts with

12/27/05, EAST Version: 2.0.1.4

the upper surface and the lower surface of the <u>wafer</u>, respectively. A second

drive mechanism drives rotatably the upper and lower roll $\underline{\text{brushes,}}$ to rotate

the wafer.

USE - For <u>disc</u>-shaped semiconductor waver during semiconductor <u>wafer</u> manufacture.

ADVANTAGE - Enables **brush cleaning** with a pair of vertical roll **brush** by

rotation drive of second drive mechanism. Ensures <u>cleaning of wafer</u> <u>edge</u> by

providing horizontally <u>wafer edge cleaning brush to wafer</u>. Prevents wafer from

deviating by using regulation $\underline{\text{roller}}$. DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure

shows the cross-sectional view of a washing apparatus. (2) semiconductor

wafer; (6) drive roller; (15) connection unit; (17) first drive
mechanism; (21)

lower roll <u>brush</u>; (22) upper roll <u>brush</u>; (50) <u>wafer edge cleaning</u> brush.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/4

TITLE-TERMS: WASHING APPARATUS <u>DISC</u> SHAPE SEMICONDUCTOR <u>WAFER</u> SEMICONDUCTOR

WAFER MANUFACTURE WAFER EDGE CLEAN BRUSH HORIZONTAL SEMICONDUCTOR

WAFER CONTACT PERIPHERAL EDGE WAFER

DERWENT-CLASS: U11

EPI-CODES: U11-C06A1B;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1999-081848